

**Редакционная коллегия**

**Н. Л. Истомина**, д-р физ.-мат. наук, Московский авиационный институт, кафедра Управление инновациями, Московский университет геодезии и картографии, кафедра оптико-электронных приборов (Москва)

**А. В. Наумов**, член-корр. РАН, д-р физ.-мат. наук, Институт спектроскопии РАН, Московский педагогический государственный университет, заведующий кафедрой теоретической физики им. Э. В. Шпольского (Москва)

**А. С. Борейшо**, д-р техн. наук, Институт лазерной техники и технологий Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова (Санкт-Петербург)

**Г. Т. Микаелян**, д-р техн. наук, «НПП «ИНЖЕКТ», Институт магистратуры НИЯУ МИФИ (Саратов)

**Е. В. Земляков**, канд. техн. наук, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, Институт лазерных и сварочных технологий (ИЛИСТ) (Санкт-Петербург)

**В. Ю. Венедиктов**, д-р физ.-мат. наук, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» (Санкт-Петербург)

**О. А. Алексеева**, д-р физ.-мат. наук, Институт кристаллографии им. А. В. Шубникова ФИЦ «Кристаллография и Фотоника» РАН (Москва)

**И. С. Шелемба**, канд. техн. наук, ООО «Инверсия-Сенсор» (Пермь)

**Председатель редакционного совета:**

**И. Б. Ковш**, д-р физ.-мат. наук, президент Лазерной ассоциации

**Редакционный совет**

**С. А. Бабин**, член-корреспондент РАН, д-р физ.-мат. наук, Институт автоматизации и электрометрии СО РАН (Новосибирск)

**Ю. В. Бажанов**, д-р техн. наук, ОАО НПК «Системы прецизионного приборостроения» (Москва)

**А. В. Будаговский**, д-р техн. наук, ВНИИ генетики и селекции плодовых растений им. И. В. Мичурина (Тамбовская обл., Мичуринск)

**Г. И. Долгих**, академик РАН, Тихоокеанский океанологический институт им. В. И. Ильичева ДВО РАН (Владивосток)

**А. Г. Казанский**, д-р физ.-мат. наук, Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова (Москва)

**А. В. Карменян**, д-р техн. наук, Государственный университет ДонХва (Хуалинь), Исследовательский центр биофотоники и молекулярной визуализации, Национальный Ян Мин университет Тайпея (Тайпей)

**В. Н. Крутиков**, д-р техн. наук, ВНИИ оптико-физических измерений, Высшая школа экономики (Москва)

**Е. В. Кузнецов**, д-р техн. наук, НИИ «Полус» им. М. Ф. Стельмаха, Москва

**А. А. Лутвинов**, член-корр. РАН, д-р физ.-мат. наук, Институт космических исследований РАН (Москва)

**В. П. Минаев**, канд. техн. наук, «НТО ИРЭ-Полус», группа компаний IPR Photonics

**В. В. Осипов**, член-корр. РАН, д-р физ.-мат. наук, Институт электрофизики УрО РАН, Уральский физико-технический университет (Екатеринбург)

**Р. В. Ромашко**, член-корр. РАН, д-р физ.-мат. наук, Институт автоматизации и процессов управления ДВО РАН (Владивосток)

**Г. А. Туричин**, д-р техн. наук, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, Институт лазерных и сварочных технологий (ИЛИСТ) Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого (Санкт-Петербург)

**Чжу Сяо**, директор Национального исследовательского центра лазерных технологий Хуанжонского университета, президент Лазерной ассоциации оптической долины Китая, (Ухань, провинция Хубэй, Китай)

**В. Я. Шур**, д-р физ.-мат. наук, Институт естественных наук и математики Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина, Уральский центр коллективного пользования «Современные нанотехнологии» (Екатеринбург)

**И. А. Щербаков**, академик РАН, д-р физ.-мат. наук, Институт общей физики им. А. М. Прохорова РАН, Московский физико-технический институт (МФТИ) (Москва)

**Компетентное мнение****588**

С. К. Кулов

**Уникальность нашей продукции в технологии изготовления и обширных возможностях применения**

**Конференции, выставки, семинары****598**

А. В. Наумов, А. В. Полесских, А. С. Башкатов

**Как рождаются дорожные карты: обзор материалов Форума «Микроэлектроника-2023»**

**Материалы и покрытия****608**

А. М. Тарасов, Д. В. Новиков, Д. В. Горелов, С. С. Генералов, В. В. Амеличев

**Повышение излучательной способности ИК-источников путем формирования эмиссионного покрытия методом вакуум-термического испарения**

**Общие вопросы отрасли. События. Документы****614**

К. И. Бабошин

**Отраслевая экспертиза проектов и привлечение финансирования предприятиями высокотехнологичных отраслей**

**Новости****620**

Н. П. Ковалец, С. А. Бедин, И. В. Разумовская, А. В. Наумов

**Гигантское комбинационное рассеяние света как способ инспекции дефектов и трещин металлических покрытий диэлектрических материалов**

**Оптические измерения****622**

П. С. Завьялов, Е. В. Власов, А. В. Белобородов, М. С. Кравченко, А. А. Гуцина, Д. В. Скоков

**Бесконтактная система измерения геометрических параметров решеток ионных двигателей**

**Оптические устройства и системы****632**

И. П. Шишкин, А. П. Шкадаревич

**Многофункциональный бинокль**

**Оптико-электронные системы и комплексы****638**

А. С. Юсуповский, В. В. Гришачев

**Обнаружение систем скрытого видеонаблюдения на основе датчика глубины смартфона**

**Editorial Staff**

**N. L. Istomina**, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Moscow Aviation Institute, Department of Innovation Management, Moscow University of Geodesy and Cartography, Department of Optoelectronic Devices (Moscow)  
**A. V. Naumov**, corresponding member of RAS, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Institute of Spectroscopy of RAS, Moscow State Pedagogical University, Head of the Department of Theoretical Physics n. a. E. V. Shpolsky (Moscow)  
**A. S. Boreisho**, Doctor of Engineering Sciences, Institute of Laser Engineering and Technology of the Baltic State Technical University "VOENMEH" n. a. D. F. Ustinov (St. Petersburg)  
**G. T. Mikaelyan**, Doctor of Engineering Sciences, SIE "INJECT", Institute of Master studies at NRNU MEPhI (Saratov)  
**E. V. Zemlyakov**, Cand. of Engineering Sciences, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University (St. Petersburg)  
**V. Yu. Venediktov**, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, St. Petersburg State Electrotechnical University "LETI" (St. Petersburg)  
**O. A. Alekseeva**, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Shubnikov Crystallography Institute of the Russian Academy of Sciences (Moscow)  
**I. S. Shelemba**, Cand. of Engineering Sciences, Inversion-Sensor LLC (Perm)

**Chairman of the Editorial Board:**

**I. B. Kovsh**, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, President of the Laser Association

**Editorial Board**

**S. A. Babin**, corresponding member of RAS, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Siberian branch of RAS Institute of Automation and Electrometry (Novosibirsk)  
**Yu. V. Bazhanov**, Doctor of Engineering Sciences, SPC Systems of Precision Instrumentation OJSC (Moscow)  
**A. V. Budagovsky**, Doctor of Engineering Sciences, All-Union Scientific and Research Institute of Genetics and selection of fruit plants n. a. I. V. Michurin (Tambov Region, Michurinsk)  
**G. I. Dolgikh**, Academician of the Russian Academy of Sciences, Pacific Oceanological Institute n. a. V. I. Il'ichev, FEB of RAS (Vladivostok)  
**A. G. Kazansky**, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Faculty of Physics, M. V. Lomonosov Moscow State University (Moscow)  
**A. V. Karmenyan**, Doctor of Engineering Sciences, Dong Hwa State University (Hualin), Biophotonics and Molecular Imaging Research Centre, National Yang Ming University of Taipei (Taipei)  
**V. N. Krutikov**, Doctor of Engineering Sciences, All-Union Scientific and Research Institute of Optical and Physical Measurements, Higher School of Economics (Moscow)  
**E. V. Kuznetsov**, Doctor of Engineering Sciences, POLYUS Research Institute of M. F. Stelmakh  
**A. A. Lutovinov**, corresponding member of RAS, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Space Research Institute of RAS (Moscow)  
**V. P. Minaev**, Candidate of Engineering Sciences, SEO IRE-Polus, IPG Photonics Group  
**V. V. Osipov**, corresponding member of RAS, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Institute of Electrophysics, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Ural Physical-Technical University (Yekaterinburg)  
**R. V. Romashko**, corresponding member of RAS, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Institute of Automation and Control Processes FEB of RAS (Vladivostok)  
**G. A. Turichin**, Doctor of Engineering Sciences, St. Petersburg State Marine Technical University, Institute of Laser and Welding Technologies (ILIST) of St. Petersburg Polytechnic University n. a. Peter the Great (St. Petersburg)  
**Zhu Xiao**, Director of the National Laser Technology Research Center of the University of Huangzhong, President of the Laser Association of the Optical Valley of China, (Wuhan, Hubei Province, China)  
**V. Ya. Shur**, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Institute of Natural Sciences and Mathematics of the Ural Federal University n. a. B. N. Yeltsin, Ural Centre for Collective Use "Modern Nanotechnologies" (Yekaterinburg)  
**I. A. Scherbakov**, Academician of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Institute of General Physics n. a. A. M. Prokhorov of RAS, Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT) (Moscow)

**Competent Opinion**

**588** *S. K. Kulov*  
**The Uniqueness of Our Products in Manufacturing Technology and Extensive Application Possibilities**

**Conferences, Exhibitions, Seminars**

**598** *A. V. Naumov, A. V. Polesskiy, A. S. Bashkatov*  
**How the Roadmaps are Made: Review of Proceedings of Forum Microelectronics 2023**

**Materials & Coatings**

**608** *A. M. Tarasov, D. V. Novikov, D. V. Gorelov, S. S. Generalov, V. V. Amelichev*  
**Increased Emissivity Ir Sources By shaping emissive coating Method Vacuum-Thermal Evaporation**

**General Issues of the Industry. Developments. Documents**

**614** *K. I. Baboshin*  
**Industry Expert Evaluation of Projects and Fund Raising by the High-Tech Industrial Enterprises**

**News**

**620** *N. P. Kovalets, S. A. Bedin, I. V. Razumovskaya, A. V. Naumov*  
**Giant Raman Scattering of Light as a Way to Inspect Defects and Cracks Metal Coatings Dielectric Materials**

**Optical Measurements**

**622** *P. S. Zavialov, E. V. Vlasov, A. V. Beloborodov, M. S. Kravchenko, A. A. Gutschina, D. V. Skokov*  
**Non-Contact Measurement System for Geometric Parameters of Ion Thruster Grids**

**Optical Devices & Systems**

**632** *I. P. Shishkin, A. P. Shkadarevich*  
**Multifunctional Binoculars**

**Optical-Electronic Systems & Complexes**

**638** *A. S. Yusupovsky, V. V. Grishachev*  
**Detection of Covert CCTV Systems Based on the Smartphone Depth Sensor**